

# RA6963

## LCD 控制器

### HTS/LTS 測試報告

受委託之檢測單位 : 清盛電子股份有限公司  
台灣高雄市楠梓加工出口區中央路37之2號

檢測完成日期 : 西元 2010 年 3 月 16 日

製造公司名稱 : 瑞佑科技股份有限公司  
台灣新竹科學工業園區工業東四路 19-1 號 7 樓  
TEL : 886-3-5637888      FAX : 886-3-5637666





**CHANT WORLD**  
*Technology, Inc.*

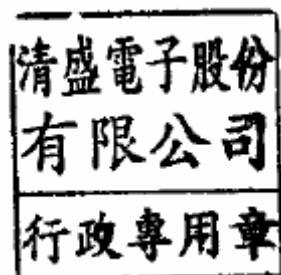
**RAiO Technology Inc.**

**高溫及低溫實驗測試報告**

*Report Date : Mar. 16 '2010*

*Prepared : Sharon*

*Approval : YT Lee*





## 報告內容

<b>1. 一般說明</b>	
1.1 待測物敘述.....	頁次 2
1.2 待測物測試擺置條件 .....	頁次 2
1.3 待測物功能動作條件 .....	頁次 2
<b>2. 高溫測試</b>	
2.1 測試設備功能敘述.....	頁次 3
2.2 實驗室環境條件.....	頁次 3
2.3 測試參考文件 .....	頁次 3
2.4 測試條件.....	頁次 3
2.5 測試結果.....	頁次 3
<b>3. 低溫測試</b>	
3.1 測試設備功能敘述.....	頁次 4
3.2 實驗室環境條件.....	頁次 4
3.3 測試參考文件 .....	頁次 4
3.4 測試條件.....	頁次 4
3.5 測試結果.....	頁次 4
附件.....	頁次 5~7



## 1. 一般說明

### 1.1 待測物敘述

1. Company: RAiO
2. Part No: RA6963L2NA (Datecode: 1001-N)
3. Package : LQFP67, 14\*20mm
- 4 . Q'ty : 50 / 50 (total 100ea)
5. Test Items :
  - 5.1. HTS : 150°C, 1000hours (各自取 50ea IC , 單獨作HTS) ;
  - 5.2. LTS : -50°C, 1000hours (各自取 50ea IC , 單獨作LTS)

### 1.2 待測物擺置及週邊簡圖：

如附件照片

### 1.3 待測物功能動作條件：

無



## 2. 高溫測試

### 2.1 測試設備功能敘述

測試機台	型號	校驗有效日期
RISEN	RHD-603T	2010/07/14

### 2.2 實驗室環境條件

溫度：21±3°C

相對濕度：23%±3%

### 2.3 測試參考文件

測試條件係依據委託公司要求

### 2.4 測試條件

待測物為靜態狀態

測試溫度：150°C

測試時間：1000小時

### 2.5 測試結果

2.5.1 測試結束後，觀察產品外觀，無異常情況。

2.5.2 經客戶自行執行功能測試(Functional Test)，全部合格。



### 3. 低溫測試

#### 3.1 測試設備功能敘述

測試機台	型號	校驗有效日期
Haier	DW-50W255	2010/07/19

#### 3.2 實驗室環境條件

溫度：21±3°C

相對濕度：23%±3%

#### 3.3 測試參考文件

測試條件係依據委託公司要求

#### 3.4 測試條件

待測物為靜態狀態

測試溫度：-50°C

測試時間：1000小時

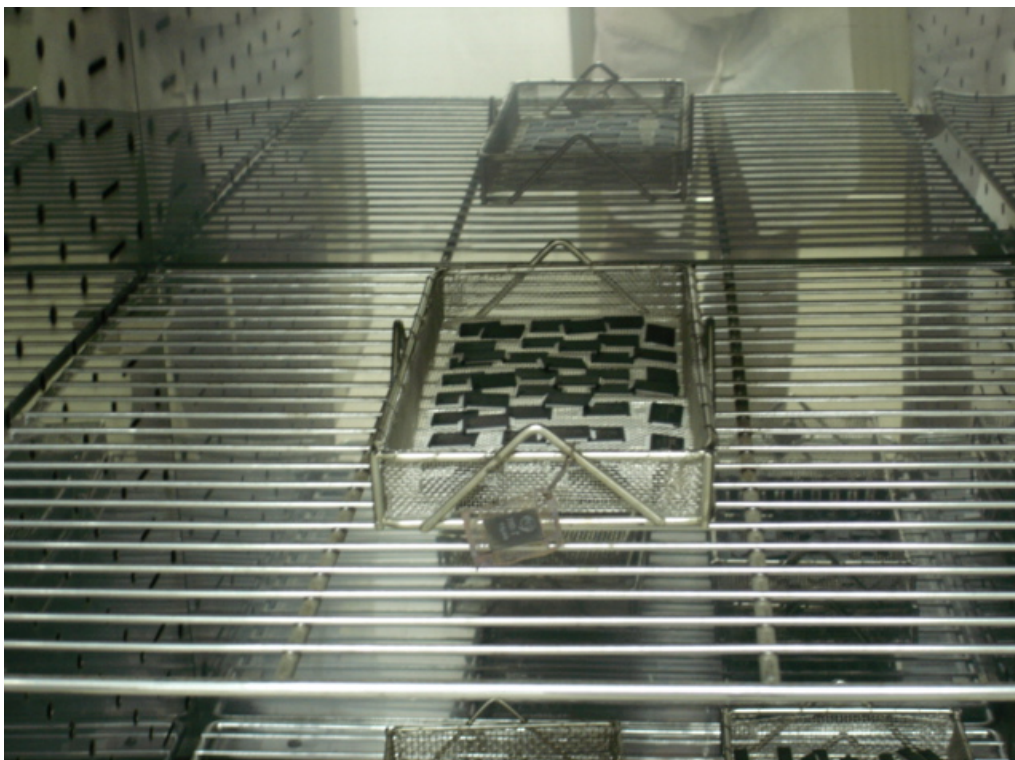
#### 3.5 測試結果

3.5.1 測試結束後，觀察產品外觀，無異常情況。

3.5.2 經客戶自行執行功能測試(Functional Test)，全部合格。

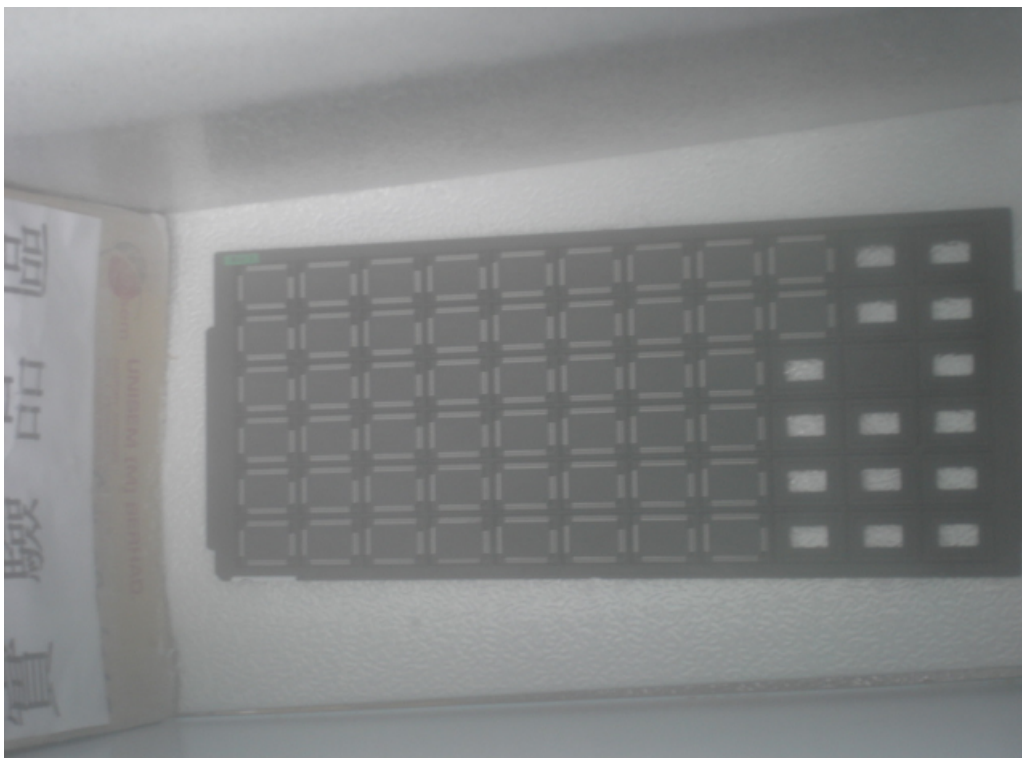
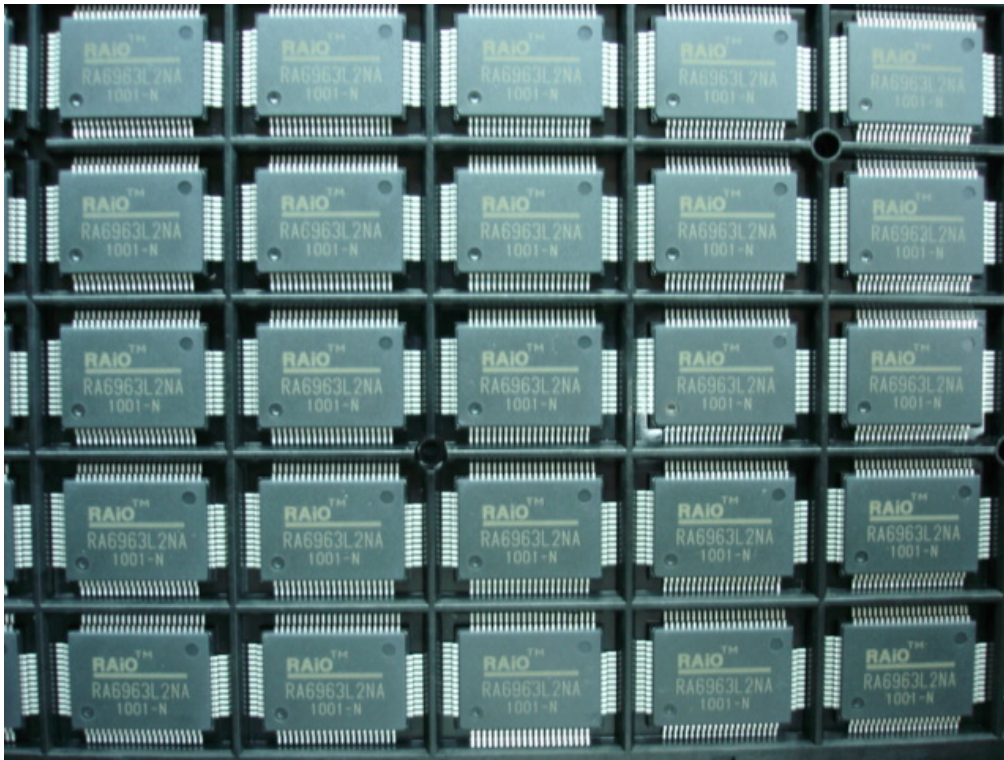


附件 1: 高溫測試照片





附件 2: 低溫測試照片







附件 3:高溫之功能測試報告

**FT測試紀錄表**

TYPE\_NO : RA6963L2NA      ORDER\_NO : P003004      良率下限 : 98      測試溫度 : 25  
SSE批號 : RTT1030010      客戶批號 : 1X7255      原批量 : 50      剩餘量 : 50

日期:時間	測試量	BIN 1	BIN 2	BIN 3	BIN 4	BIN 5	BIN 6	BIN 7	BIN 8	外觀不良	短少	FAIL 總量	工 號
2010/03/13 01:48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	YL0082
日期:時間	FAIL 重測量	BIN 1	BIN 2	BIN 3	BIN 4	BIN 5	BIN 6	BIN 7	BIN 8	外觀不良	短少	FAIL 總量	工 號
2010/03/16 14:49	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84043
合計		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
百分比 (合計 / 原批量)		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

總出量 : 50 EA 良品數 : 50 EA 不良品數 0 EA 外觀不良 0 EA 短少數 : 0 EA 總良率 : 100.0 %  
(100.0 %)      (0.0 %)      (0.0 %)      (0.0 %)

(09TES415. E)

附件 4:低溫之功能測試報告

**FT測試紀錄表**

TYPE\_NO : RA6963L2NA      ORDER\_NO : P003004      良率下限 : 98      測試溫度 : 25  
SSE批號 : RTT1030011      客戶批號 : 1X7255      原批量 : 50      剩餘量 : 50

日期:時間	測試量	BIN 1	BIN 2	BIN 3	BIN 4	BIN 5	BIN 6	BIN 7	BIN 8	外觀不良	短少	FAIL 總量	工 號
2010/03/13 01:46	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	YL0082
日期:時間	FAIL 重測量	BIN 1	BIN 2	BIN 3	BIN 4	BIN 5	BIN 6	BIN 7	BIN 8	外觀不良	短少	FAIL 總量	工 號
2010/03/13 01:50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	YL0082
合計		50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
百分比 (合計 / 原批量)		100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

總出量 : 50 EA 良品數 : 50 EA 不良品數 0 EA 外觀不良 0 EA 短少數 : 0 EA 總良率 : 100.0 %  
(100.0 %)      (0.0 %)      (0.0 %)      (0.0 %)

(09TES415. E)